



Training AFM

“Microscopia a Forza Atomica”

A cura del Prof. Gianpiero Buscarino

Il training è gratuito e dedicato a studenti di dottorato e giovani ricercatori dell'Università degli studi di Palermo che vogliono acquisire nuove conoscenze sulla microscopia a forza atomica (AFM) e sulla sua applicazione per l'analisi di superfici di campioni solidi o nano-sistemi 0D, 1D e 2D depositati su substrato (sistemi biologici, semiconduttori, metalli, isolanti, polimeri...).

Le attività sono volte a fornire una formazione teorico pratica sui fondamenti di questa tecnica ed allo svolgimento di esperimenti reali. Il training sarà tenuto interamente a distanza attraverso la piattaforma TEAMS.

Il training è aperto anche a partecipanti esterni all'Ateneo. Per partecipanti di aziende private è richiesta una fee di iscrizione pari a 100 €.

Programma – 03 marzo 2022

11:00 - 13:00: Introduzione alla tecnica di microscopia a forza atomica ed alla relativa strumentazione. Preparazione dei campioni;

14.00 - 16.00: Training pratico su Bruker FAST-SCAN Bio;

Saranno presentate analisi sia su superfici di campioni solidi che su nano-sistemi depositati su substrato.

Iscrizione:

Verranno prese in considerazione le richieste che hanno come **oggetto: training AFM**. Nella richiesta di iscrizione specificare i dati del partecipante ed eventualmente il corso di dottorato, relativo ciclo e il nome del tutor.

ATeN Center
ADVANCED TECHNOLOGIES NETWORK CENTER

Laboratorio di
Superfici, Film
Sottili e
Dispositivi

03 Marzo 2022

ATEN CENTER
Viale Delle Scienze
Edificio 18/A

iscrizioni aperte fino al

1 MARZO 2022

email:
eventi.aten@unipa.it

info training:
gianpiero.buscarino@unipa.it